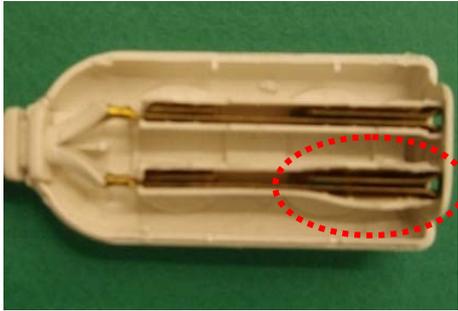


テスト結果詳細

写真 : 開閉試験



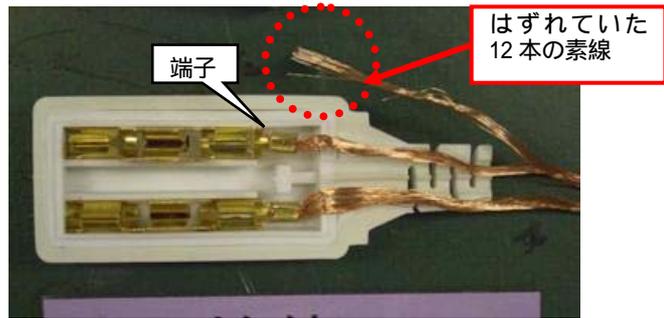
開閉試験後の内部



開閉試験後の差込口

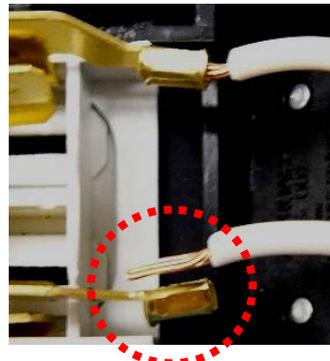
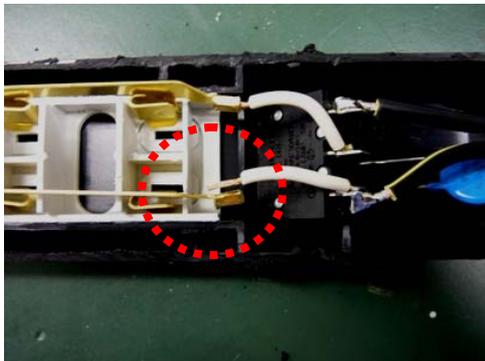
電流を流して、差込口にプラグの抜き差しを繰り返した結果、絶縁物が変形した。保持力の低下や、絶縁性能が劣化し、漏電による過熱事故につながる恐れがある。

写真 : 端子とコードの接続部の構造検査



コードの接続部分で、50本ある素線のうち、12本が端子からはずれていた。接触抵抗の増加による過熱や、はずれた素線が異極の導体に接触して短絡事故の要因となる。

写真 : コード接続部の強度試験



コードの接続部分に引張荷重を加えたと同時にコードが抜けた。接続部のゆるみは、接触抵抗の増加から過熱事故につながる恐れがある。

